

## 시간 지연을 갖는 2차 시스템 근사를 이용한 외란 관측기 설계

정구종\*, 손영익\*, 정유석\*  
\*명지대학교 전기공학과 NPTC

### Design of Disturbance Observer Using a Second-Order Plus Dead Time Modeling Technique

Goo-jong Jeong\*, Young-Ik Son\*, Yu-seok Jeong\*  
\*NPTC, Department of Electrical Engineering, Myoungji University

**Abstract** – 제어대상 시스템에 시간지연과 외란이 동시에 존재하는 경우, 스미스 예측기와 외란 관측기를 함께 사용하면 시간지연과 외란으로 인한 시스템의 성능저하를 완화할 수 있다. 하지만 시간지연이 유동적인 경우에는 설계된 스미스 예측기와 외란 관측기의 역할을 기대하기 어렵다. 본 논문은 시간지연을 갖는 2차 시스템 모델링 기법에 기반한 PID 제어기를 이용하여 시간 지연의 유동성에 대해 스미스 예측기와 외란 관측기의 장인성을 향상시키는 방법을 제안한다.

#### 1. 서 론

시간지연이 존재하는 시스템의 안정성과 제어 성능을 향상시키기 위해 많은 연구가 진행되고 있다. 한편, 시간지연과 외란이 동시에 존재하는 경우 이를 보상하기 위하여 스미스 예측기와 외란 관측기를 함께 사용하는 제어 기법이 제안되었다[1]. 이는 스미스 예측기를 이용하여 시간지연으로 인한 제어성능의 저하 및 불안전성을 보상하고, 비최소 위상 시스템에 대한 외란 관측기를 사용하여 외란의 영향을 감소시키는 방법이다[2-3].

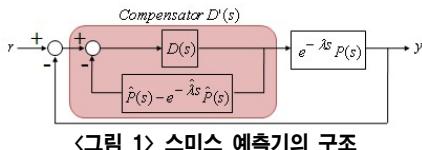
스미스 예측기 기반의 제어기는 시간지연이 존재하는 시스템의 안정성과 제어 성능을 향상시키기 위한 대표적인 제어 알고리즘이지만 불확실한 시간 지연을 갖는 경우에는 안정성을 보장하기 힘들며 안정성을 보장하기 위해서는 제어 성능의 저하를 피할 수 없다[4]. 또한, 논문 [1]에서 사용된 외란 관측기의 경우 유동적인 시간지연에 대해서는 설계시 예상했던 성능을 보장할 수 없다.

본 논문은 [1]에서 제안된 제어기의 시간지연에 대한 장인성을 향상시키기 위해 Wang 등에 의해 제안된 PID 투닝 방법을 사용한다[5]. 이 방법은 시간지연 항을 포함한 2차 근사화 모델링 기법을 기반으로 하여 시스템의 계수 및 지연 시간 등의 불확실성에 장인한 제어기를 설계할 수 있게 한다. 논문 [1]과 [5]의 시스템에 대한 모의실험을 통해 제안된 방법의 적용 가능성을 확인한다.

#### 2. 본 론

##### 2.1 스미스 예측기의 구조

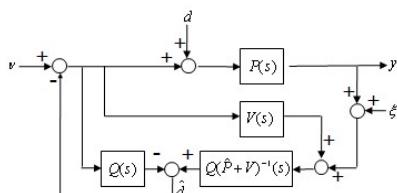
스미스 예측기는 그림 1과 같은 구조이며 제어기  $D(s)$  설계시 시간지연 항을 무시하고 전달함수  $P(s)$ 만을 고려하면 되게 한다. 본 논문에서는 제어기 설계시 그림 1과 같이 실제 시스템  $e^{-\lambda s}P(s)$  대신 시간지연을 갖는 2차 시스템으로 근사된  $e^{-\lambda s}\hat{P}(s)$ 를 사용한다. 제어기  $D(s)$ 는 유동적인 시간지연에 장인한 PID 투닝 방법으로 설계한다[5].



〈그림 1〉 스미스 예측기의 구조

##### 2.2 비최소 위상 시스템의 외란 관측기 구조

시간지연으로 인한 비최소 위상 시스템의 외란 제거를 위해 본 논문에서는 그림 2와 같은 외란 관측기를 사용한다[3].



〈그림 2〉 비최소 위상 시스템의 외란 관측기

$P(s)$ 는 실제 시스템 전달함수이고,  $\hat{P}(s)$ 는 2차 근사된 공정 시스템 전달함수이다,  $Q(s)$ 는  $Q$ -필터,  $d$ 는 외란,  $\xi$ 는 측정 잡음이다. 외란 관측기는 공정시스템의 역함수를 사용하기 때문에  $\hat{P}(s)$ 가 비최소 위상 시스템일 경우에는 폐루프 시스템의 불안정을 초래하기 쉽다. 본 논문에서는  $V(s)$ 를 설계하여  $(\hat{P} + V)(s)$ 를 최소 위상 시스템으로 만들어 적용한다[2]. 시간지연을 갖는 시스템은 항상 비최소 위상 시스템이 되기 때문에 위의 구조와 같은 외란관측기를 사용하였다.

일반적으로  $V(s)$ 는  $P(s)$ 를 안정화시키는 제어기의 역수를 사용하며, 추정한 외란  $\hat{d}$ 과 실제 외란  $d$ 의 오차를 줄이기 위해서는 외란의 주파수에서  $(\hat{P}(s) + V(s)) \approx \hat{P}(s)$  혹은  $V(s) \approx 0$ 이 되도록 설계한다. 본 논문에서는 [5]에서 제안한 PID 제어기의 역수를 사용한다.

그림 2의 출력  $y$ 에 대한 식은 다음과 같다.

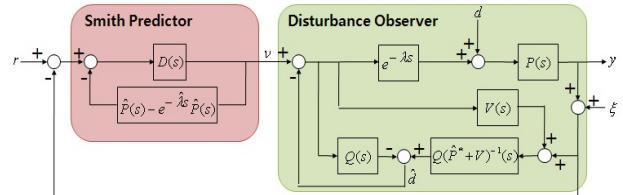
$$y = \frac{P(\hat{P} + V)}{(\hat{P} + V)(1 - Q) + (P + V)Q} \nu + \frac{P(\hat{P} + V)(1 - Q) + PVQ}{(\hat{P} + V)(1 - Q) + (P + V)Q} d \quad (1)$$

$$- \frac{PQ}{(\hat{P} + V)(1 - Q) + (P + V)Q} \xi$$

저주파 영역에서  $Q(s)=1$ 이고  $|\hat{P}(s) + V(s)| \approx |\hat{P}(s)|=0$ 이면, 외란에 대한 영향은 사라지고, 고주파 영역에서  $Q(s)=0$ 이면 잡음에 대한 영향이 사라진다. 따라서,  $y \approx \hat{P}(s)\nu$ 임을 알 수 있다[1,3].

##### 2.3 시간 지연 시스템에 대한 외란 관측기 적용

시간지연과 외란이 동시에 존재하는 경우에 대해 본 논문에서는 그림 3과 같은 제어기를 제안한다. 주제어기로 사용된 스미스 예측기는 시간지연으로 인한 성능 저하를 보상하고, 비최소 위상 시스템에 대한 외란 관측기는 외란에 대한 영향을 줄일 수 있다. 이때, 제어기  $D(s)$ 와 외란 관측기의  $V(s)$ 에 따라 시간지연에 장인성을 향상시킬 수 있음을 예측를 통해 확인할 수 있다.



〈그림 3〉 외란 관측기 및 스미스 예측기 적용

그림 3에서  $\hat{P}^*(s)$ 는 공정 시스템  $\hat{P}(s)$ 에 시간 지연항의 Padé 근사식을 결합한 형태이다. 출력  $y$ 에 대한 식은 다음과 같다.

$$y = \frac{(\hat{P}^* + V)e^{-\lambda s} P}{(\hat{P}^* + V) - Q(\hat{P}^* - Pe^{-\lambda s})} \nu + \frac{P(\hat{P}^* + V) - Q\hat{P}^* P}{(\hat{P}^* + V) - Q(\hat{P}^* - Pe^{-\lambda s})} d \quad (2)$$

$$- \frac{Qe^{-\lambda s} P}{(\hat{P}^* + V) - Q(\hat{P}^* - Pe^{-\lambda s})} \xi$$

위 식에서도 앞 결과 같은 해석으로  $y \approx \hat{P}^*(s)\nu$ 임을 알 수 있다.

#### 3 설계 예제

본 장에서는 모의실험을 통해 제안된 방법의 성능을 시험한다. 그림 3에서 대상 시스템  $P(s)$ 는 아래와 같다. 0.3초의 시간지연이 발생하는 경우를 고려한다.

$$P(s) = \frac{1}{(s^2 + 2s + 3)(s + 3)}, \lambda = 0.3[\text{sec}] \quad (3)$$

위 시스템은 아래와 같이 시간지연을 갖는 2차 근사 모델로 나타낼 수 있다[5].

$$\hat{P}(s) = \frac{1}{3.825s^2 + 6.903s + 9.573}, \hat{\lambda} = 0.523[\text{sec}] \quad (4)$$

논문 [5]의 방법으로 설계된 아래 제어기는 비교적 넓은 범위의 시간 지연에 대해서  $P(s) \times e^{-\lambda s}$ 를 안정하게 한다.(아래 그림 6 참조)

$$D(s) = 3.885 + \frac{5.388}{s} + 2.153s \quad (5)$$

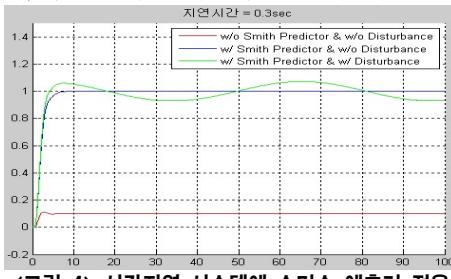
본 논문의 모의실험에 사용된 환경은 표 1과 같다.

<표 1> 모의실험 변수

|      |                      |        |                 |
|------|----------------------|--------|-----------------|
| Q-필터 | 분모(m) : 4            | 외란     | $3\sin(0.1t)$   |
|      | 분모(n) : 3            | 측정 잡음  | $0.5\sin(200t)$ |
|      | 시정수( $\tau$ ) : 0.05 | 기준입력 값 | 1               |

### 3.1 시간 지연 시스템에 대한 스미스 예측기 적용

그림 4는 외란이 없을 때 스미스 예측기의 성능 개선과 외란이 존재할 때 PID 제어기  $D(s)$ 의 한계를 나타낸다. 시간지연으로 인한 현상은 개선되었으나, 외란으로 정상상태 값이 크게 달라진다.



<그림 4> 시간지연 시스템에 스미스 예측기 적용

### 3.2 시간 지연 시스템에 대한 외란 관측기 설계

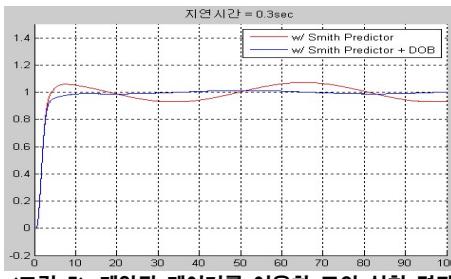
외란의 영향을 감소시키기 위해 외란 관측기를 설계한다. 본 논문에서는 시간지연 요소를 Pade 1차 근사로 고려하였다. 식 (6)은 시간 지연을 포함한 공칭 시스템이다.

$$\hat{P}^*(s) = \frac{1}{3.825s^2 + 6.903s + 9.573} \times \frac{-s + 3.824}{s + 3.824} \quad (6)$$

외란 관측기의  $V(s)$ 는  $D(s)$ 의 역수이므로 식 (7)과 같다.

$$V(s) = \frac{s}{2.153s^2 + 3.885s + 5.388} \quad (7)$$

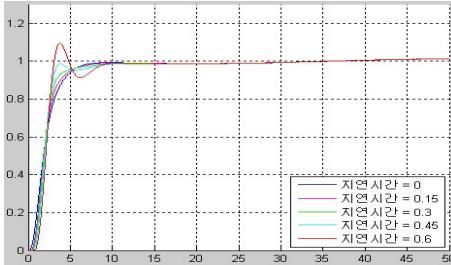
그림 5는 외란이 있을 때 외란 관측기 유무에 따른 모의실험 결과이다. 스미스 예측기와 비최소 위상 시스템에 대한 외란 관측기를 사용함으로써 시간지연 시스템의 외란 효과를 감소시킬 수 있음을 확인할 수 있다.



<그림 5> 제안된 제어기를 이용한 모의 실험 결과

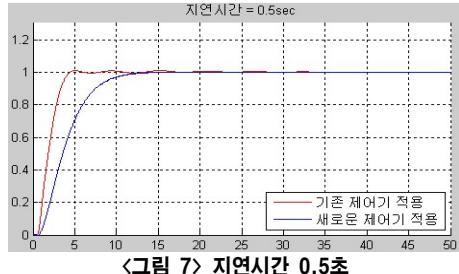
### 3.3 불확실한 지연시간에 대한 시스템의 성능 변화

그림 6은 지연시간의 변화에 따른 시스템의 성능 변화를 나타낸다. 정적인 지연시간 0.3초를 기준으로 설계된 제어기는 유동적인 지연시간 0초에서 약 0.6초까지의 범위에서 안정함을 보이고 있다.



<그림 6> 지연시간의 변화에 따른 시스템의 성능 변화

아래 그림들은 논문 [1]의 예제에 대하여 본 논문의 제어기 설계방법을 적용하여 비교하였다. 설계시의 시간지연 0.5초에 대해 성능 변화를 나타낸다. 논문 [1]의 제어기에 비해 새로운 제어기가 보다 강인함을 알 수 있다.



<그림 7> 지연시간 0.5초



<그림 8> 지연시간 0초



<그림 9> 지연시간 1.0초

## 4. 결 론

본 논문에서는 시간지연과 외란이 존재하는 시스템에 대하여 스미스 예측기와 외란 관측기를 적용함으로써 제어성능을 행상시킬 수 있음을 보였다. 논문 [5]의 결과를 이용함으로써 제안된 제어기의 강인성을 향상시키는 방법을 제안하였다.

## 감사의 글

- 이 논문은 2008년도 정부(과학기술부)의 재원으로  
한국과학재단의 지원을 받아 수행된 연구임  
(R11-2001-093-03005-0 (2008))
- 이 논문은 2007년 정부(교육인적자원부)의 재원으로  
한국학술진흥재단의 지원을 받아 수행된 연구임  
(KRF-2007-611-D00013)

## 참 고 문 헌

- [1] 정구종, 손영익, 정유석, “시간 지연을 갖는 시스템에 대한 외란 관측기 기반 강인 제어기 설계”, 2008 정보 및 제어 심포지엄 논문집, pp. 213~214, 2008
- [2] O.J.M. Smith, "Closed control of loops with dead time". Chemical Engineering Progress, 53, May, pp. 217~219, 1957
- [3] Y.I. Son, H. Shim, N.H. Jo and S.J. Kim, "Design of Disturbance Observer for Non-minimum Phase Systems Using PID Controllers", Proc. of SICE2007, pp. 196~201, Japan, Sep. 2007.
- [4] 송기원, “시간지연을 갖는 LonWorks/IP 가상 디바이스 네트워크에서 직류모터의 위치주종제어, 전자공학회 논문지”, 제43권 SC편 제 4호, pp. 210~21, 2006
- [5] Q.-G. Wang, T.-H. Lee, H.-W. Fung, Q. Bi, Y. Zhang, "PID Tuning for Improved Performance", IEEE Trans. Contr. Sys. Tech., Vol. 7 No. 4, pp. 457~465, 1999